

вязки с источником излучения. Заметим, что поляризатор и четвертьволновая пластина, обычно используемые для развязки, в данном случае неприменимы. Ослабить взаимное влияние источника и интерферометра можно либо путем введения амплитудных ослабителей, либо путем увеличения параметра ϕ . Последнее приводит к уменьшению коэффициента отражения АИ на рабочей частоте, увеличению рабочей области дискриминатора и уменьшению крутизны его характеристики. При использовании амплитудных ослабителей применение фазовой пластины 2 необязательно. Это видно из выражений (3) — (5). Достаточно того, чтобы параметр β равнялся $\pi/4$, т. е. чтобы оптическая ось фазовой пластины 4 устанавливалась под углом 45° по отношению к направлению электрического вектора падающей линейно поляризованной волны.

Рассматриваемый анизотропный интерферометр целесообразно использовать в качестве селективного отражателя лазерного резонатора. При определенном выборе параметров интерферометр обладает хорошими избирательными свойствами (аппаратная острота его выше, чем у широко используемого интерферометра Фабри — Перо), а прошедшее излучение, которое неизбежно присутствует из-за неидеальности изготовления отражающих покрытий, можно использовать в системе автоподстройки, не вносящей модуляцию в излучение.

ЛИТЕРАТУРА

1. А. с. 545877 (СССР). Многолучевой интерферометр/Ф. В. Карпушко, Г. В. Синицын.— Опубл. в Б. И., 1977, № 5.
2. Бельтюгов В. И., Троицкий Ю. В. «Двойная» частотная селекция в лазерах при помощи отражающего интерферометра с анизотропным заполнением.— Квант. электрон., 1980, т. 7, № 11, с. 2299—2304.
3. Новиков М. А., Тертышник А. Д. Оптические резонаторы с анизотропными элементами.— Изв. вузов. Радиофизика, 1976, т. 19, № 3, с. 364—372.
4. Аруманов В. Н. и др. Частотный дискриминатор оптического диапазона на базе анизотропного резонатора.— Квант. электрон., 1975, т. 344, с. 30—33.
5. Захаров М. И., Прилепских В. Д. О возможности управления параметрами лазерного излучения с помощью анизотропного отражающего интерферометра.— В кн.: Тезисы докл. II Всесоюз. научн. конф. «Применение лазеров в приборостроении, машиностроении и медицинской технике». М.: МВТУ им. Н. Э. Баумана, 1979, с. 583.
6. Захаров М. И., Прилепских В. Д. Исследование характеристик анизотропного двухзеркального отражающего интерферометра.— В кн.: Тезисы докл. Всесоюз. конф. «Приборы и методы спектроскопии». Новосибирск, 1979, с. 24—26.
7. Молчанов В. Я., Скроцкий Г. В. Матричный метод вычисления собственных состояний поляризации анизотропных оптических резонаторов.— Квант. электрон., 1971, № 4, с. 3—26.
8. Аруманов В. Н. и др. Одночастотный YAG-Nd-лазер, стабилизированный по эталонному анизотропному резонатору.— Автометрия, 1977, № 2, с. 125—127.

Поступила в редакцию 24 июля 1984 г.

УДК 537.224.33

И. Б. ТРОФИМОВ

(Москва)

ДВУПРЕЛОМЛЕНИЕ, ВЫЗВАННОЕ ДИССИММЕТРИЕЙ В НЕПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПЛАСТИНЕ ТВЕРДОГО РАСТВОРА ЦТСЛ, ПОЛЯРИЗОВАННОЙ ПО ТОЛЩИНЕ

Вероятный механизм возникновения двупреломления в мелкозернистом твердом растворе ЦТСЛ X/Y/Z* при распространении световой волны вдоль направления вектора поляризующего поля был уже описан в [1].

* ЦТСЛ X/Y/Z — цирконат-титанат свинца лантана, где X — содержание лантана в ат. %; Y, Z — содержание циркония и титана в процентах соответственно.

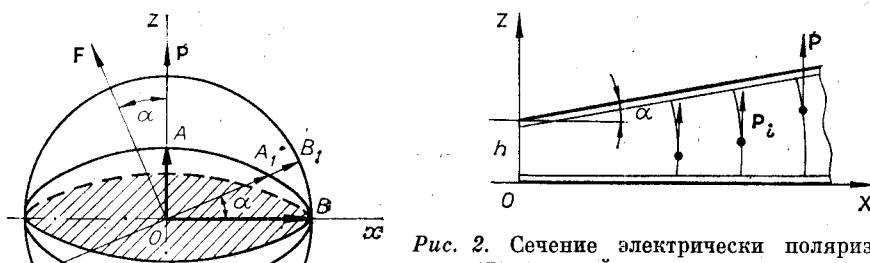


Рис. 2. Сечение электрически поляризованной клиновидной пластины плоскостью ZX .
Явление двупреломления в сегнетоэлектрических твердых растворах при распространении света вдоль направления поляризации позволяет использовать его при создании конструктивно простых, компактных и экономичных оптоэлектронных устройств, сопрягаемых с микроэлектронной аппаратурой (в отличие от устройств на основе поперечного электроптического эффекта).

Цель настоящей работы — исследование явления двупреломления в поляризованной по толщине неплоскопараллельной пластине мелкозернистого твердого раствора ЦТСЛ в отсутствие внешнего электрического поля, а также в процессе перехода твердого раствора из электрически поляризованного (ЭП) в электрически деполяризованное (ЭД) состояние.

Электрически поляризованное состояние. В ЭП-состоянии тонкая пластина ЦТСЛ ведет себя подобно оптически отрицательному монокристаллу [2] и оптическая ось такого «кристалла» параллельна результирующему вектору поляризации P . При этом оптическая индикатриса (рис. 1) представляет собой эллипсоид вращения, сплюснутый в направлении вектора P , а полуоси OA и OB суть главные показатели преломления N_e и N_o .

В плоскопараллельной пластине ЦТСЛ, поляризованной по толщине, поляризованный свет, распространяясь вдоль направления P , двупреломления не претерпевает (пластина механически свободна).

Рассмотрим теперь клиновидную пластину ЦТСЛ (рис. 2) с направлением клина вдоль оси X . Толщина пластины h изменяется вдоль оси X пропорционально $\operatorname{tg} \alpha$, где α — угол наклона клина, т. е. удовлетворяется равенство $z = h + kx$, где k — тангенс угла наклона клина (причем $kx/h \ll 1$). Светопропускающие поверхности клиновидной пластины снабжены прозрачными электродами. При электрической поляризации в каждой точке сечения клиновидной пластины плоскостью ZOX направление вектора поляризации P_i будет различным и определяется направлением касательной к траектории силовой линии в данной точке (при $P = P_R$, где P_R — остаточная поляризация насыщения твердого раствора ЦТСЛ).

Допустим, что средний угол наклона вектора поляризации P по отношению к оси Z примерно равен углу α наклона клина, а сам вектор P направлен вдоль оси Z . Тогда вектор волновой нормали F (см. рис. 1) будет направлен под углом α к оси Z .

След от эллиптического сечения оптической индикатрисы плоскостью волнового фронта в виде отрезка B_1B_2 показан на рис. 1. Отрезки OA_1 , OB_1 соответствуют показателям преломления n_e и n_o .

Рассмотрим двупреломление в клиновидной пластине ЦТСЛ, находящейся в ЭП-состоянии с поляризацией $P = P_R$ при $E = 0$, где E — напряженность внешнего электрического поля. Примем угол наклона вектора волновой нормали F к оси Z в пределах $1^\circ < \alpha < 5^\circ$.

По данным Хертлинга [3], для ЭП-состояния твердого раствора ЦТСЛ 8/65/35 эффективное двупреломление приобретает значение

$\Delta\bar{n} \approx 8 - 16 \cdot 10^{-3}$. Воспользуемся среднеарифметическим значением $\Delta\bar{n} \approx 0,012$ для оценки величины двупреломления, вызванного клиновидностью поляризованной мелкозернистой пластиинки ЦТСЛ. Исходя из этого, главная полуось эллипсоида, соответствующая радиусу описанной сферы, $OB = N_0 = 1,00$. Тогда главная полуось эллипсоида соответствует $N_e = OA = 0,988$ (см. рис. 1). Запишем параметрическое уравнение эллипса центрального сечения индикаторы в виде

$$z = OA \sin \alpha; \quad x = OB \cos \alpha = R \cos \alpha. \quad (1)$$

Учитывая (1), выпишем выражение для разности показателей преломления n_0 и n_e из геометрических соображений (см. рис. 1):

$$\Delta\bar{n} = n_0 - n_e = OB_1 - OA_1 = R - \sqrt{R^2 \cos^2 \alpha + OA^2 \sin^2 \alpha}, \quad (2)$$

или

$$\Delta\bar{n} = N_0 - \sqrt{N_0^2 \cos^2 \alpha + N_e^2 \sin^2 \alpha}. \quad (3)$$

Подставляя значение величин, входящих в выражение (3), получим для $\alpha = 1^\circ$

$$\Delta\bar{n} = 1 - \sqrt{0,9996 + 0,976 \cdot 0,0003} \approx 5,5 \cdot 10^{-5}.$$

Для угла $\alpha = 5^\circ$ соответственно $\Delta\bar{n} \approx 15 \cdot 10^{-5}$.

Приведенный расчёт показывает, какого значения величины $\Delta\bar{n}$ можно достичь при незначительном искажении плоскопараллельности мелкозернистой пластиинки ЦТСЛ, находящейся в состоянии остаточной поляризации насыщения (при $E = 0$).

Двупреломление при переходе твердого раствора ЦТСЛ из ЭП- в ЭД-состояние. Воспользуемся этой же моделью клиновидной пластиинки и рассмотрим переход твердого раствора ЦТСЛ из ЭП- в ЭД-состояние, при котором $E \neq 0$.

Допустим, что клин ориентирован так, как показано на рис. 3. Будем считать, что напряжение на электродах пластиинки изменяется адиабатически медленно по линейному закону. В сечении клина плоскостью ZOX в фиксированный момент времени рассмотрим два элементарных участка (см. рис. 3). В одном из этих участков при данном напряжении на электродах мгновенное значение напряженности E_1 электрического поля соответствует, например, поляризации насыщения. При этом результатирующий вектор P_1 коллинеарен вектору E_1 . В другом элементарном участке пластиинки мгновенное значение напряженности электрического поля E_2 недостаточно для переполяризации всего объема доменов. В последнем случае результатирующий вектор P_2 антипараллелен вектору E_2 . Первый элементарный участок, в котором вектор P_1 направлен согласно вектору E_1 , испытывает деформацию растяжения, а второй — деформацию сжатия. В результате под влиянием обратного пьезоэффекта на границе двух участков возникает деформация сдвига. По мере увеличения напряжения на электродах клиновидной пластиинки переполяризация элементарных участков осуществляется последовательно в направлении утолщения клина. Под действием сдвиговых деформаций, пропорциональных $\operatorname{tg} \alpha$ и распространяющихся вдоль оси OX , в том же направлении изменяется значение диэлектрической непроницаемости ϵ [4]. При этом происходит деформация оптической индикаторы, т. е. индуцируется двупреломление в направлении оси OZ (см. рис. 3).

Поскольку в нашем случае имеет место тангенциальное смещение фронта напряженности E , то под действием обратного пьезоэффекта

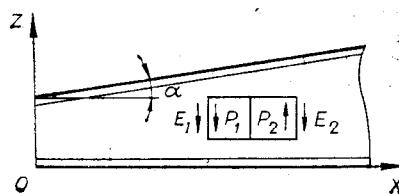


Рис. 3. Переполяризация элементарных участков клиновидной пластиинки.

сдвиговые деформации индуцируют тангенциальную составляющую поляризации. Поэтому в соответствии с принципом симметрии Кюри [4, 5] одноосный кристалл становится двуосным, т. е. мы имеем дело с диссимметрией.

По определению [5], в механически свободном образце пьезоэлектрика электрооптический эффект является совокупностью двух эффектов: первичного и вторичного, т. е. электрооптического и пьезооптического.

Запишем уравнение для $\Delta\eta$ с учетом деформаций [5], возникающих в клиновидной пластине:

$$\Delta\eta_{ij} = r_{ijk}E_k + p_{ijlm}d_{klj}E_k, \quad (4)$$

где r_{ijk} , p_{ijlm} — компоненты тензора электрооптических и упругооптических коэффициентов соответственно; d_{klj} — компоненты тензора пьезоэлектрических модулей; E_k — компоненты вектора электрического поля.

Пользуясь сокращенной матричной записью [6], после суммирования по соответствующим индексам получим уравнения для изменения поляризационных констант:

$$\Delta\eta_1 = [r_{13} + (p_{11} + p_{12})d_{31} + p_{13}d_{33}]E_3; \quad (5)$$

$$\Delta\eta_3 = (r_{13} + 2p_{31}d_{31} + p_{33}d_{33})E_3; \quad (6)$$

$$\Delta\eta_5 = (r_{51} + p_{44}d_{15})E_1, \quad (7)$$

где $E_3 = E_1 \operatorname{tg} \alpha$; α — угол наклона клина.

Связь между $\Delta\eta$ и Δn описывается выражением [4]

$$\Delta\eta = -(2/n_0^2)\Delta n. \quad (8)$$

Здесь n_0 — показатель преломления обыкновенной волны.

Пользуясь (8), запишем уравнение для Δn_1 , Δn_3 , Δn_5 :

$$\Delta n_1 = -\frac{1}{2}n_0^3[r_{13} + (p_{11} + p_{12})d_{31} + p_{13}d_{33}]E_3; \quad (9)$$

$$\Delta n_3 = -\frac{1}{2}n_0^3(r_{13} + 2p_{31}d_{31} + p_{33}d_{33})E_3; \quad (10)$$

$$\Delta n_5 = -\frac{1}{2}n_0^3(r_{51} + p_{44}d_{15})E_1. \quad (11)$$

Выражения (9) — (11) подтверждают трансформацию оптической индикатрисы из эллипсоида вращения в трехосный эллипсоид. Таким образом, обратный пьезоэффект ответствен за диссимметрию [5]. Искомое эффективное двупреломление в направлении оси Z запишем, используя (10) и (11):

$$\begin{aligned} \Delta n_z = \Delta n_3 - \Delta n_5 = & -\frac{1}{2}n_0^3[r_{13} + (p_{11} + p_{12})d_{31} + p_{13}d_{33}] \times \\ & \times E_3 - (r_{51} + p_{44}d_{15})E_1. \end{aligned} \quad (12)$$

Используя известные значения электрооптических, упругооптических и пьезооптических коэффициентов для системы ЦТСЛ, проведем оценку эффективного двупреломления по формуле (12). Причем $n_0 = 2,51$, по [2]. Для твердого раствора ЦТСЛ линейные электрооптические коэффициенты r мало отличаются друг от друга и находятся в пределах одного порядка. Примем $r \approx 6 \cdot 10^{-10}$ м/В из [3]. Упругооптические коэффициенты составляют величину порядка 10^{-4} [5]. Для ЦТСЛ 8/65/35 пьезомодули в среднем равны $2 \cdot 10^{-10}$ К/Н. Значение напряженности электрического поля примем из [1]: $3,5 \cdot 10^5$ В · м⁻¹.

Таким образом, подставляя в (12) принятые значения коэффициентов, получаем $\Delta n \approx 0,0016$ (для света с длиной волны $\lambda = 0,63$ мкм).

Рассуждения, приведенные выше, справедливы также и для случая линзообразного искажения плоскопараллельности пластины, так как линза может быть кусочно аппроксимирована множеством клиньев, а механизм возникновения двупреломления при этом подобен.

ВЫВОДЫ

1. Объяснен механизм возникновения двупреломления в неплоско-параллельной пластине мелкозернистого твердого раствора ЦТСЛ, поляризованной по толщине.

2. На модели клиновидной пластины показано, что неоднородное электрическое поле под влиянием обратного пьезоэффеクта вызывает диссимметрию и, как следствие, двупреломление в мелкозернистом твердом растворе ЦТСЛ.

3. Даны оценки величины двупреломления, полученного за счет клиновидности поляризованной пластины твердого раствора ЦТСЛ, а также при его переополяризации.

Автор благодарит А. М. Аллавердиева за ценные советы при подготовке работы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Трофимов И. Б. О механизме возникновения двупреломления в поликристаллическом твердом растворе системы ЦТСЛ в режиме продольного электрооптического эффекта.— Автометрия, 1980, № 5.
2. Land C. E., Thacher P. D., Haertling G. H. Electrooptic ceramic.— Appl. Sol. St. Sci., 1974, v. 4, p. 137—233.
3. Haertling G. H., Land C. E. Hot pressed (Pb, La) (Zr, Ti) O₃ ferroelectric ceramics for electrooptic applications.— J. Am. Ceram. Soc., 1971, v. 54, N 1, p. 1—11.
4. Най Дж. Физические свойства кристаллов.— М.: Мир, 1967.
5. Сиротин Ю. Н., Шаскольская М. П. Основы кристаллофизики.— М.: Наука, 1979.
6. Ландau Л. Д., Лишниц Е. М. Электродинамика сплошных сред.— М.: Физматгиз, 1959.

Поступила в редакцию 12 марта 1984 г.

УДК 621.391 : 53.08

В. П. БАКАЛОВ, Н. П. РУССКИХ
(Москва)

О ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ СВЕРТКИ ПРИ НЕИЗВЕСТНОМ ЯДРЕ В СЛУЧАЕ МНОГОМЕРНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО-ОГРАНИЧЕННЫХ СИГНАЛОВ

Введение. Задачи интерпретации результатов наблюдений, как правило, относятся к обратным задачам, решение которых часто сводится к решению уравнения свертки. Обычно при этом предполагается, что ядро уравнения свертки известно. Однако на практике распространены ситуации, когда ядро неизвестно. Например, при регистрации сигналов оно может являться случайной функцией и изменяться от измерения к измерению. Так, в оптике при расфокусировке изображения, при искажениях пространственного сигнала, возникающих при взаимном движении источника и регистрирующего устройства, и из-за турбулентности атмосферы регистрируемый сигнал представляет свертку неискаженного сигнала с неизвестной при измерении функцией (ядром).

Казалось бы, что в указанных случаях решение уравнения свертки без какой-либо априорной информации о сигнале и ядре невозможно. Однако можно показать, что при несущественных ограничениях на сигнал и искажающую функцию уравнение свертки теоретически разрешимо.

Известно, что при определенных условиях возможно восстановление многомерных пространственно-ограниченных дискретных [1—3] и непрерывных [4] сигналов по их амплитудному спектру или автокорреляцион-